

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации  
топологии интегральной микросхемы

№ 2009630007

Топология тестовых структур для измерения электрических параметров КМОП- транзисторов с целью аттестации базовой технологии изготовления микросхем серии 5509

Правообладатель(ли): *Государственное учреждение  
«Научно-производственный комплекс «Технологический центр»  
Московского государственного института  
электронной техники» (RU)*

Автор(ы): *Басаева Татьяна Сергеевна, Кузнецов  
Евгений Васильевич, Белостоцкая Светлана Олеговна (RU)*

Заявка № 2008630057

Дата поступления 4 декабря 2008 г.

Зарегистрировано в Реестре топологий  
интегральных микросхем 3 февраля 2009 г.

Дата начала срока действия исключительного права  
3 февраля 2009 г.



*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности, патентам и товарным знакам*

*Б.П. Симонов*